

**双通道速率/厚度监视器**

Fil-Tech, Inc. 的 SQM-200 为下一代速率/厚度监视器。SQM-200 实现了较昂贵复杂的控制器才具有的一些特性，是半自动沉积监控的理想仪器。SQM-200 既可处理简单的单传感器工艺，也可处理较为复杂的共沉积工艺和合金工艺。SQM-200 具有高对比度 LCD 显示器和直观的滚动框/旋钮菜单操作系统。SQM-200 设计为用户友好型，具有“在线帮助”、上下文相关的菜单以及操作画面上的“提示”等功能。

**特性**

- 与本公司的控制器具有同样高速度和高精度的测量引擎；
- 即使在很低速率时也采用时间平均法，以得到高超的精度；
- 在大的封闭空间内或在使用行星型夹具时采用空间平均法，以得到高超的精度；
- 独立模式可使 SQM-200 作为两个完全分开的监视器使用；
- 挡板延时可精确控制薄膜质量；
- 可进行速率取样，大大地延长了较厚薄膜的晶体寿命；
- 先进的合金模式含有联动挡板延时功能；
- “时间/功率”特性即使在晶体出现故障时也可使薄膜完成；
- 速率、厚度和速率偏差曲线图；
- 以质量或厚度为单位进行显示；
- 8 个可编程数字输入，8 个可编程数字输出和 4 个模拟输出。

**Fil-Tech, Inc.**

6 Pinckney St., Boston, MA 02114

电话: 617-227-1133

传真: 617-743-1743

电话: 800-743-1743

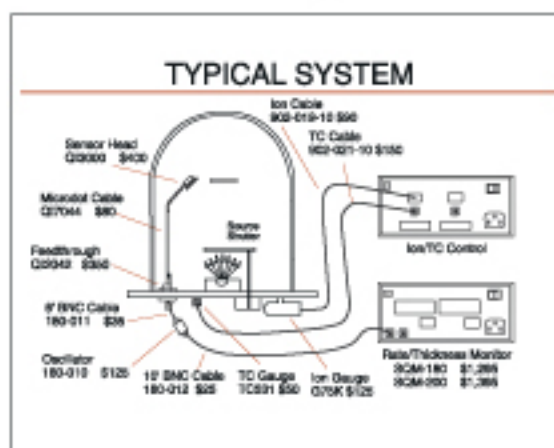
www.filtech.com  
sales@filtech.com

**双通道速率/厚度监视器**

多模式操作	单薄膜模式 (“simple”) 后备模式 (晶体交换) 空间平均模式 合金模式 独立模式 (两台监视器)
厚度分辨率 (不平均) 速率分辨率 (不平均) 厚度分辨率 (50 个样品平均) 速率分辨率 (50 个样品平均)  高精度  高速度 测量范围	0.0133Å/测量 0.0133Å/秒 0.002Å/测量 0.02Å/秒  0.03 Hz / 测量, 2 ppm, 相对  每秒测量十次 500KÅ 铝当量
模拟输出功能 四个 -10V ~ +10V 模拟输出	计算机控制 速率 速率偏差 厚度
继电器输出 (可自由分配) 八个 1.5 安 SPST 常开触点	手动 (前面板) 源挡板 基片挡板 晶体挡板 晶体故障 设定点时间 设定点厚度 良好速率 计算机控制

**订购信息**

- SQM-200 速率/厚度监视器
- 200-010 远程模拟振荡器
- 200-011 6" BNC 电缆 (公/母插头)
- 200-012 10' BNC 电缆 (母/母插头)
- QI8010 石英晶体合金电极, 6MHz, 10 片
- QI8008 石英晶体合金电极, 6MHz, 10 片
- QI3000 单传感器头
- QI7044 30.75" Microdot 电缆
- QI2042 直通式 1" 螺栓



**Fil-Tech, Inc.**

6 Pinckney St., Boston, MA 02114

电话: 617-227-1133  
 传真: 617-743-1743  
 电话: 800-743-1743

www.filtech.com  
 sales@filtech.com